



Сведения о документе - Adaptive analog-to-digital conversion using self-dithering in data acquisition systems

1 из 1

[Экспорт](#) [Скачать](#) [Еще... >](#)

11th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, ICECS 2004
2004, Номер статьи WC3.4, Pages 627-630
11th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, ICECS 2004; Tel Aviv; Israel; 13 December 2004 до 15 December 2004; Номер категории 04EX941; Код 65946

Adaptive analog-to-digital conversion using self-dithering in data acquisition systems (Conference Paper)

Pereira, J.M.D., Girão, P.S., Postolache, O.

[Просмотр дополнительных авторов](#) ▾[Сохранить всех в список авторов](#)^aInstituto de Telecomunicações, DEEC, IST, Av. Rovisco Pais, 1049-001 Lisboa, Portugal^bEscola Superior de Tecnologia, Institute Politécnico de Setúbal, 2910-761 Setúbal, Portugal[Просмотр дополнительных организаций](#) ▾

Краткое описание

Sampling rate and resolution are two main competing interests in digital data acquisition systems design. High sampling rate data acquisition systems, usually based on flash converters, exhibits low-resolution, and high resolution systems, usually based on sigma-delta or dual-slope converters, are generally slow. However, a compromise can be obtained if digital signal processing techniques are used after analog-to-digital conversion. This paper presents a solution that can be used to optimize the performance of data acquisition systems based on analog-to-digital data acquisition boards. A dynamic self-adjusted sampling rate and dithering are proposed in order to improve signal-to-noise relation and measurement accuracy. Simulation and experimental results will be presented to evaluate digitizing system performance gains when the proposed solution is applied. © 2004 IEEE.

Актуальность темы SciVal

Тема: Analog-To-Digital Converter | Linearity Test | Built-in Self-test

Процентиль актуальности: 72.936

Ключевые слова автора

[Data acquisition systems](#) [Dither](#) [Sampling](#)

Включенные в указатель ключевые слова

Engineering controlled terms: [Computer simulation](#) [Data acquisition](#) [Sampling](#) [Signal processing](#) [Signal to noise ratio](#)Engineering uncontrolled terms: [Analog-to-digital data acquisition](#) [Dither](#)Engineering main heading: [Analog to digital conversion](#)

ISBN: 0780387155

Тип источника: Conference Proceeding

Язык оригинала: English

Тип документа: Conference Paper

Спонсоры: IEEE Circuits and Systems Society, Freescale Semiconductor Ltd., Tower Semiconductor Ltd., Orbotech Ltd., IBM Israel and IBM Haifa Research Labs.

Цитирования в документах

Сообщайте мне, когда этот документ будет цитироваться в Scopus:

[Задать оповещение о цитировании >](#) [Настроить канал цитирования >](#)

Связанные документы

Найти дополнительные связанные документы в Scopus исходя из следующего параметра:

[Авторы >](#) [Ключевые слова >](#)

Pereira, J.M.D.; Instituto de Telecomunicações, DEEC, IST, Av. Rovisco Pais, Portugal

© Copyright 2008 Elsevier B.V., All rights reserved.

[Что такое Scopus](#)

[Содержание](#)

[Блог Scopus](#)

[Интерфейсы API Scopus](#)

[Вопросы конфиденциальности](#)

[Switch to English](#)

[日本語に切り替える](#)

[切换到简体中文](#)

[切换到繁體中文](#)

[Помощь](#)

[Связь с нами](#)

ELSEVIER

[Условия использования](#) » [Политика конфиденциальности](#) »

Авторские права © Elsevier B.V. » Все права защищены. Scopus® является зарегистрированным товарным знаком Elsevier B.V.

Мы используем файлы cookie, чтобы предоставлять услуги и повышать их качество, а также для индивидуального подбора содержимого. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.

 RELX